

Primer acte de la Secció Catalana de Metrologia

El 27 de gener de 2017 es presentà, amb gran èxit d'assistents, la Secció Catalana de Metrologia (SCM). El gran interès mostrat pels professionals del món de la metrologia es posà de manifest amb el nombre d'inscripcions rebudes, que féu que la sala quedés petita. És per això que, en primer lloc, volem mostrar la satisfacció per l'acompanyament en els primers passos de la SCM i agrair la nombrosa assistència, sense deixar de demanar disculpes a les persones inscrites que finalment no van poder assistir a la jornada.



L'acte inaugural de la Secció Catalana de Metrologia s'inicià amb el president de l'IEC, el Sr. Joandomènec Ros, qui mostrà la seva satisfacció per ampliar l'àmbit de l'IEC amb nous camps tècnics. A continuació, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, la Sra. Núria Salán, va donar la benvinguda als professionals de la metrologia i va animar la gent assistent a l'acte a participar en aquesta nova secció. Per últim, el sub-

director general de Seguretat Industrial, el Sr. Isidre Masalles, en nom de la Generalitat de Catalunya, donà suport a la nova secció i recalçà la importància d'aquesta ciència dins la nostra societat.

La jornada continuà amb tres ponències: una per a fer una presentació global de la metrologia, una altra per a presentar la Secció Catalana de Metrologia, i una darrera per a donar una visió històrica de la metrologia.

La primera ponència fou presentada pel Sr. José Sánchez, que féu una visió global de la metrologia des dels inicis de les mesures i la necessitat d'obtenir un patró de mesura —vital per a poder establir relacions comercials— fins als nostres dies, on s'arriben a establir tres àrees dins la metrologia: la científica, la part de qualitat i la metrologia legal. Tot això complementat amb la presentació de termes metrològics d'ús freqüent i fent èmfasi en la seva correcta aplicació.

La ponència de presentació de la nova Secció Catalana de Metrologia fou exposada pel Sr. Albert Garcia amb la finalitat de donar a conèixer la SCM. En primer lloc, la ubicà dins el paraigua de l'Institut d'Estudis Catalans i la Secció Catalana de Tecnologia, ja que són els ens que li donen caràcter legal i reconeixement a Catalunya. Una cop ubicada, es van presentar alguns dels seus objectius de la Secció: difondre la metrologia en llengua catalana, ser punt de trobada de metrològics, i ésser dinamitzadora de la difusió de la metrologia dins els estudis de secundària.

Aquests objectius són la base que donen lloc al seguit d'activitats que es varen presentar. Cal destacar la importància d'acollir nous socis per poder assolir els objectius. Tant el suport no actiu, ja que potser no es disposa del temps necessari, com el més actiu de tots són necessaris en aquest moments d'inici del camí de la Secció Catalana de Metrologia, i us animem que us hi inscriviu per saber que hi sou i que no sou només lectors d'articles virtuals.

La ponència que tancà la jornada fou presentada pel Sr. Eugeni Vilalta i portà per títol «Moments metrològics». De manera distesa, féu un veloç repàs metrològic que ens portà des de l'any -4000 a l'any 2018, en què s'aturà en moments concrets i detalls històrics per demostrar que la metrologia és una ciència que ens ha acompanyat durant tota la

història de la humanitat sense adonar-nos-en. Plantejà l'evolució de la definició de les unitats en el temps fins a arribar a les unitats naturals basades en constants universals.

